

FAX-ANTWORT

030 | 63 92 17 29



Hiermit melde ich mich verbindlich für das Fokusseminar
»Röntgenstrahlen treffen Photovoltaik« am **Mittwoch,**
den 6. Mai 2009 an.

Anmeldungen für Tagungsgäste sind bis zum 29.04.2009

per Fax oder E-Mail an optecbb@optecbb.de möglich.

Anschrift: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Abbestraße 2-12 (Hermann-von-Helmholtz-Bau, Hörsaal)
D-10587 Berlin-Charlottenburg

Infos: Dr. Bernd Weidner OpTecBB
Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin
E-Mail: weidner@optecbb.de, Tel.:+49 (30) 6392-1720

Titel, Vorname, Name

Firma/Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

Tagungsgebühr:

Mitglieder von OpTecBB bzw. Kompetenznetze optische Technologien:

20,00 EUR*

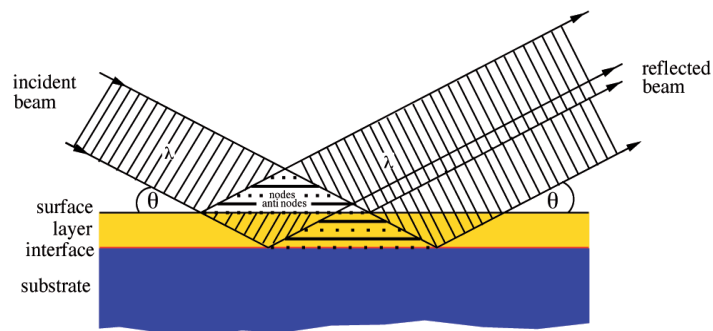
Nichtmitglieder: 40,00 EUR* *) zuzüglich 19% MwSt.

OpTecBB wird gefördert durch



Fokusseminar

»Röntgenstrahlen treffen Photovoltaik«



Mittwoch, 6. Mai 2009

09.30-16.00 Uhr

Physikalisch-Technische

Bundesanstalt (PTB)

Hermann-von-Helmholtz-Bau

Die Photovoltaik-Industrie ist eine der schnellst wachsenden Branchen. Der Bedarf an höherer Effizienz und kostensparender Herstellung von Photovoltaik-Komponenten erfordert eine bessere und genauere Charakterisierung des Herstellungsprozesses und des Materials selber. Röntgentechnologien können in diesem Prozess sehr nützlich sein, da sie Informationen über Eigenschaften der Elemente und der Struktur liefern können.

Dieses Fokuseminar soll eine effektive Diskussion über den analytischen Bedarf von Photovoltaik zwischen Wissenschaftlern in der Photovoltaikforschung und der Röntgenanalytikforschung, den Herstellern von Photovoltaik-Komponenten und von analytischen Instrumenten initiieren. Ziel ist die Definition analytischer Probleme und die Generierung von Ideen zu ihrer Lösung.

Die Region Berlin/Brandenburg ist gekennzeichnet durch eine hohe Konzentration von Forschung zu und Herstellung von Photovoltaik-Komponenten als auch durch eine sehr effektive Röntgen-Community, die zur stetigen Verbesserung von röntgenanalytischen Methoden und Instrumenten beiträgt. Das Seminar wird diese Erfahrungen zusammenführen, um eine erfolgreiche Entwicklung von beiden Technologien zu unterstützen.

Sprecher UVR:

*Prof. Dr. B. Kanngießer, Technische Universität Berlin,
Inst. für Optik und Atomare Physik
Dr. M. Haschke, Bruker AXS Microanalysis GmbH*

- 09.30 Willkommen/Welcome**
*Prof. Dr. Wolfgang Buck, PTB
Dr. Michael Haschke, Bruker AXS Microanalysis,
Prof. Dr. Birgit Kanngießer, TU Berlin*
- 09.45 “Thin-film PV Technology- requirements for analytics from an industrial point of view”**
*Dr. Axel Neisser,
SULFURCELL Solartechnik GmbH*
- 10.15 “Development of CIGS thin-film solar cells: from process control to material and module diagnostics”**
*Prof. Dr. Hans-Werner Schock,
Helmholtz Center Berlin*
- 10.45 “Challenges of structural, chemical, and electronic characterization of thin-film materials for silicon photovoltaics”**
Dr. Klaus Lips, Helmholtz Center Berlin
- 11.15 Kaffeepause/Coffee break**
- 11.30 “New X-Ray Methods for Thin-film Analysis”**
*Dr. Immo Kötschau,
centrotherm photovoltaics AG*
- 12.00 “Rapid-XRF-Messmodule für die In-situ-Prozesskontrolle an CIGS-Schichten – Erfahrungen und Ausblick”**
*Prof. Dr. Norbert Langhoff,
IfG - Institute for Scientific Instruments GmbH*
- 12.30 “Contamination and thin-film analysis by reference-free X-ray spectrometry”**
*Dr. Burkhard Beckhoff,
Physikalisch-Technische Bundesanstalt*
- 13.00 Mittagessen/Lunch break**
- 14.00 Zwei Diskussionsrunden zu CIGS und zur Dünnfilm-Si**
Round table discussion in two groups for CIGS and for thin film Si
- 15.30 Abschlussdiskussion, Zusammenfassung/ Plenary discussion, Summary**

Please note that talks will be given in German while the presenting material will be in English.

